

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□6□36□□□□□60□120□□□□□□180□220□□□□□□□□

HTC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1.□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

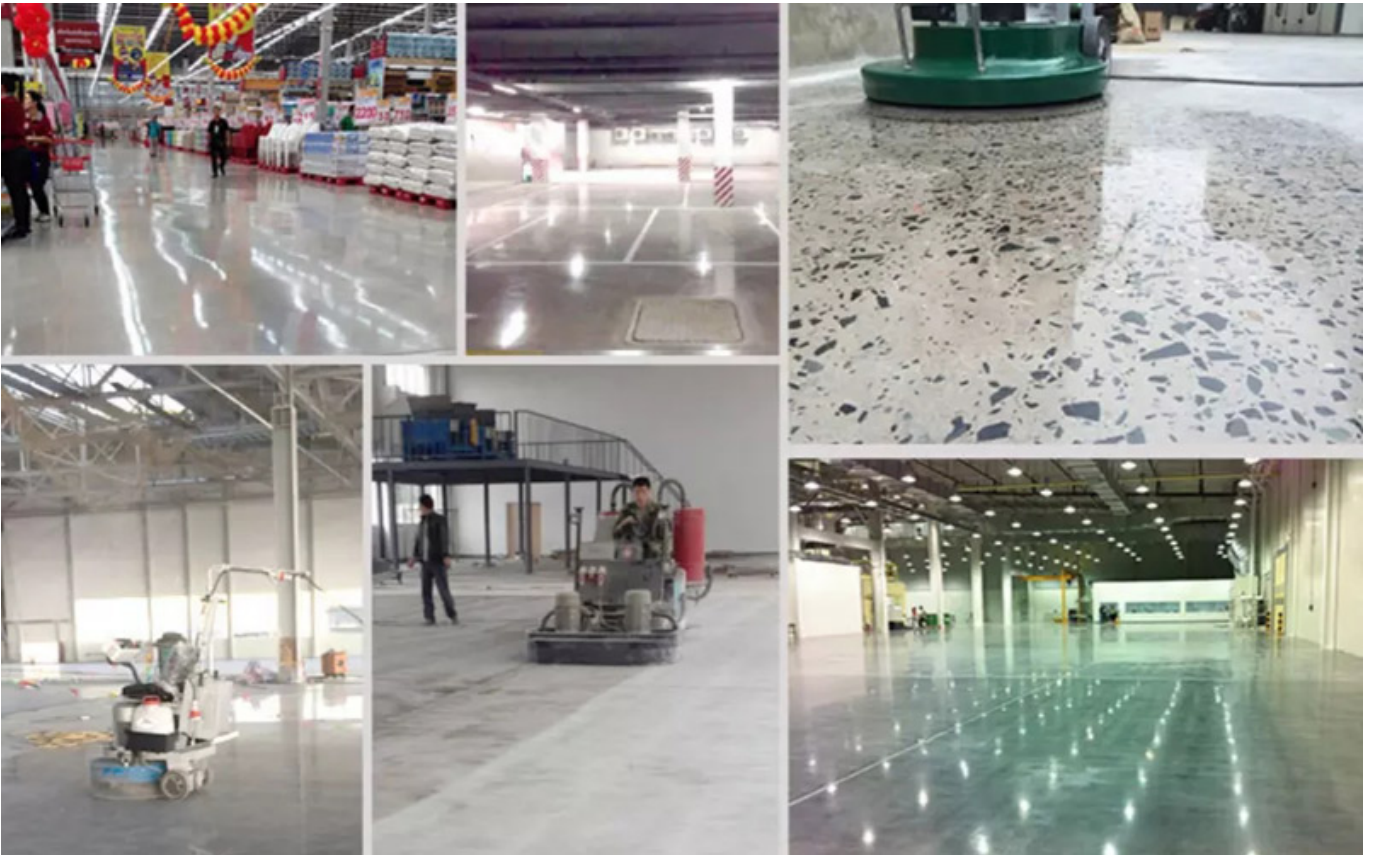
□□□□**HTC**□□□□□□□□□□

□□	□□□	□□	□□	□□□
2T.	□□	□□□□□□□□□□	HTC□□Conncting□□	6□16□24□36□46□50□80□100 □□120□180□200□270□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□



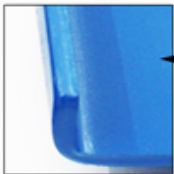
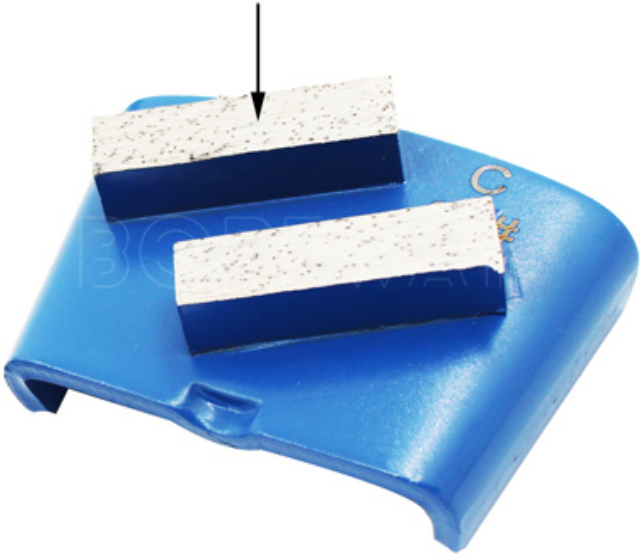
□□□□

HTC□□□□□□□□□□□□

Rectangle Segment



HTC Pad





□□□

HTC□□□□□□□□□□HTC Quick Conncting□□

□□□□□□□□□□HTC□□□□□

□□□□



<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

1. 实验目的：通过X射线衍射实验，研究样品的晶体结构，并确定其晶相组成。

实验原理：X射线衍射是一种利用X射线在晶体中的衍射现象来研究晶体结构的实验方法。当一束单色X射线照射到晶体上时，晶体中的原子或离子会对X射线产生相干散射，这些散射波在空间各个方向上相互干涉，形成衍射斑点。通过测量衍射斑点的强度和位置，可以推导出晶体的晶格参数、晶面间距以及晶相组成。

2. 实验步骤：

1. 样品制备：将待测样品研磨成粉末，装入样品架中，并密封。

2. 仪器校准：打开XRD仪，进行仪器校准，确保测量精度。

3. 数据采集：设置扫描范围、扫描速度等参数，开始数据采集。

4. 数据处理：将采集到的数据进行处理，生成衍射图谱。

5. 结果分析：根据衍射图谱，进行晶相鉴定和定量分析。

3. 实验结果：

通过XRD实验，我们得到了样品的衍射图谱。通过与标准衍射图谱对比，我们发现样品具有与标准物质相似的衍射特征，表明样品具有较好的结晶性。此外，我们还利用Rietveld精修方法对衍射图谱进行了定量分析，得到了各晶相的含量。实验结果表明，样品的晶相组成与预期相符。

0000

000000DHL0UPS0FedEx0TNT0EMS0

000000000000000000000000FOB0CNF0CIF000000000000000000000000



00000

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.



Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China 36050



+86 595-86990206 /  +86 595-86990220



/ **WhatsApp** / + 86 18650679939.



boreway@boreway.com.



Lyon Chang